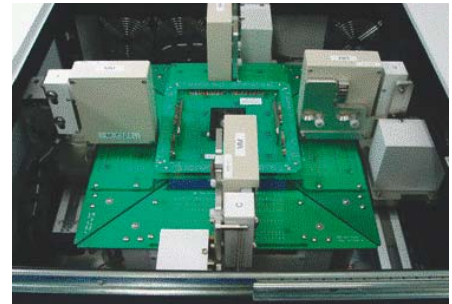


ESD耐性試験・ESD保護設計

各種ESD耐性試験

- ◆半導体デバイス、電子機器の各種ESD耐性評価サービス
- ◆IECQ独立試験所 (ISO/IEC 17025) 認証取得

- コンポーネントレベルの公的標準ESD試験
 - HBM/MM試験：
 - ・ JEITA ED4701
 - ・ JEDEC JESD22-A114/A115
 - ・ ESDA STM5.1/5.2
 - ・ AECQ100-002/3
 - ・ IEC61340-3-1/2 IEC60749-26/27
 - D-CDM試験：
 - ・ JEITA ED4701
 - ・ ESDA STM5.3
 - ・ AECQ100-011 IEC60749-28
- システムレベル公的標準ESD-Immunity試験
IEC規格 IEC61000-4-2/JASO D-010 (ISO)



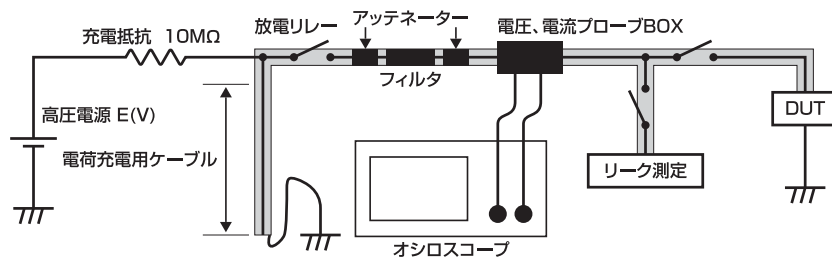
電子部品に対するHBM/MM試験装置



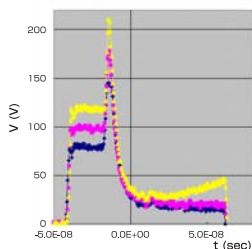
電子部品に対するFICDM/D-CDM試験装置

ESD保護設計コンサルティング

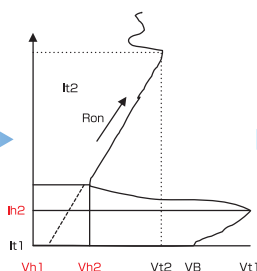
- ◆半導体デバイス開発における、ESDパラメータを用いたESD保護設計コンサルティングご提供
- ◆要求ESD耐性、保護回路面積縮小化、デバイス性能適合などを最短にて実現



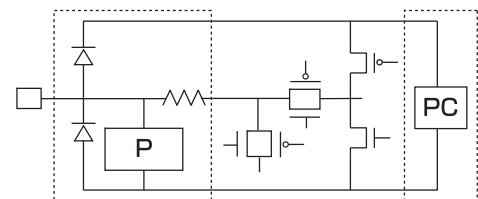
【TDR-TLP測定方法】



【各素子のESD動作測定】



【ESDパラメータ抽出】



【ESDパラメータを用いた最適ESD保護設計】